
**Surface chemical analysis — Chemical
methods for the collection of elements
from the surface of silicon-wafer working
reference materials and their
determination by total-reflection X-ray
fluorescence (TXRF) spectroscopy —**

AMENDMENT 1

*Analyse chimique des surfaces — Méthodes chimiques pour collecter
les éléments analysés de tranches de silicium comme matériaux de
référence pour l'analyse par spectroscopie de fluorescence X en
réflexion totale (TXRF) —*

AMENDEMENT 1



Pour plus d'infos, merci de nous contacter.

Association Sénégalaise de Normalisation

4 Avenue Jean Jaurès, Immeuble El Hadj Omar DIA, 6 ème Etage
Dakar - SENEGAL

Tel: +221 33 829 58 25

Email: asn@asn.sn